

名称：华润微电子（重庆）有限公司实验室

地址：重庆市沙坪坝区西永大道 25 号 A 栋 1 楼

注册号：CNAS L20336

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 05 月 26 日 截止日期：2030 年 03 月 06 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	电子元器件	1	高温反向偏置	温度、偏压和工作寿命 JESD22-A108G:2022 4.2.3.3	只测：温度： (50℃~175℃)， 电压： (5V~2000V)。 包含租用设备。	2025-05-26
				半导体器件的测试方法 MIL-STD-750-1B 18 April 2023 1038.5 条件 A	只测：二极管， 温度：(50℃ ~175℃)，电压： (5V~2000V)。 包含租用设备。	2025-05-26
				半导体器件的测试方法 MIL-STD-750-1B 18 April 2023 1039.4 条件 A	只测：晶体管， 温度：(50℃	2025-05-26



No. CNAS L20336

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					~175℃), 电压: (5V~2000V)。 包含租用设备。	
		2	高温栅极偏置	温度、偏压和工作寿命 JESD22-A108G:2022 4.2.3.4	只测: 温度: (50℃~175℃), 电压: (5V~2000V)。 包含租用设备。	2025-05-26
		3	低温储存寿命	低温储存寿命 JESD22-A119A:2015	包含租用设备。	2025-05-26
		4	高温储存寿命	高温储存寿命 JESD22-A103E.01:2021	只测: 温度: (50℃~175℃), 只含 conditionA、 conditionB、 conditionC。 包含租用设备。	2025-05-26
		5	高加速温湿度应力试验	高加速温湿度应力试验 JESD22-A110E.01:2021	只测: 温度: 130 ℃, 湿度: 85%RH, 压力: 230kPa, 电压: (5V~1200V)。 包含租用设备。	2025-05-26
		6	稳态温湿度偏置寿命试验	稳态温湿度偏置寿命试验 JESD22-A101D.01:2021	只测: 温度: 85 ℃, 湿度: 85%RH, 电压: (5V~1200V)。	2025-05-26



序号	检测对象	项目/参数		检测标准 (方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
					包含租用设备。	
		7	加速耐湿-无偏置强加速应力寿命	加速耐湿-无偏置强加速应力寿命 JESD22-A118B.01:2021	只测：温度：(121℃~130℃)，湿度：(85%RH~100%RH)，压力：(121kPa~230kPa)。 包含租用设备。	2025-05-26
		8	加速耐湿-无偏置高压蒸煮	加速耐湿-无偏置高压蒸煮 JESD22-A102E:2015	只测：温度：(121℃~130℃)，湿度：(85%RH~100%RH)，压力：(121kPa~230kPa)。 包含租用设备。	2025-05-26
		9	预处理	非密封表面安装器件在可靠性试验前的预处理 JESD22-A113I:2020	包含租用设备。	2025-05-26
2	电子元器件	1	高温反向偏置	车用分立半导体元器件的基于失效机理的应力测试验证 AEC-Q101-Rev-E March 1, 2021 表 2 第 B1 项	只测：二极管和晶体管，温度：(50℃~175℃)，电压：(5V~2000V)。 包含租用设备。	2025-05-26



No. CNAS L20336

第 3 页 共 6 页

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	高温栅极偏置	车用分立半导体元器件的基于失效机理的应力测试验证 AEC-Q101-Rev-E March 1, 2021 表 2 第 B2 项	只测：温度： (50℃~175℃)， 电压： (5V~2000V)。 包含租用设备。	2025-05-26
		3	高加速温湿度应力试验	车用分立半导体元器件的基于失效机理的应力测试验证 AEC-Q101-Rev-E March 1, 2021 表 2 第 A2 项	只测：温度：130℃，湿度： 85%RH，压力： 230kPa，电压： (5V~1200V)。 包含租用设备。	2025-05-26
		4	稳态温湿度偏置寿命试验	车用分立半导体元器件的基于失效机理的应力测试验证 AEC-Q101-Rev-E March 1, 2021 表 2 第 A2 alt 项	只测：温度：85℃，湿度： 85%RH，电压： (5V~1200V)。 包含租用设备。	2025-05-26
		5	加速耐湿-无偏置强加速应力寿命	车用分立半导体元器件的基于失效机理的应力测试验证 AEC-Q101-Rev-E March 1, 2021 表 2 第 A3 项	只测：温度： (121℃~130℃)，湿度： (85%RH~100%RH)，压力： (121kPa~230kPa)。 包含租用设备。	2025-05-26
		6	加速耐湿-无偏置高压蒸煮	车用分立半导体元器件的基于失效机理的应力测试验证 AEC-Q101-Rev-E March 1, 2021 表 2 第 A3 alt 项	只测：温度： (121℃~130	2025-05-26



No. CNAS L20336

第 4 页 共 6 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准 (方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
			中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		℃), 湿度: (85%RH~100%RH), 压力 (121kPa~230kPa)。 包含租用设备。	
		7	预处理	非密封表面贴装器件的湿度/回流焊敏感等级 J-STD-020F December, 2022	包含租用设备。	2025-05-26
				车用分立半导体元器件的基于失效机理的应力测试验证 AEC-Q101-Rev-E March 1, 2021 表 2 第 A1 项	包含租用设备。	2025-05-26
		8	间歇工作寿命	半导体器件的环境试验方法 第 1 部分: 方法 1000 至 1999 MIL-STD-750-1B 18 April 2023 Method 1037.3	包含租用设备。	2025-05-26
				车用分立半导体元器件的基于失效机理的应力测试验证 AEC-Q101-Rev-E March 1, 2021 表 2 第 A5 项	包含租用设备。	2025-05-26
		9	高温储存	半导体器件 - 机械和气候试验方法 - 第 6 部分: 高温储存 IEC 60749-6 Mar, 2017	只测: 温度: (50℃~175℃)。 包含租用设备。	2025-05-26
		10	温度循环	温度循环 JESD22-A104F.01 April, 2023	只测: 温度: (-65℃~150℃)。 包含租用设备。	2025-05-26
				车用分立半导体元器件的基于失效机理的应力测试验证 AEC-Q101-Rev-E March 1, 2021 表 2 第 A4 项	只测: 温度: (-65℃~150℃)。 包含租用设备。	2025-05-26
		11	声扫	非密封封装电子器件的声学显微技术 J-STD-035A December, 2022	租用设备。	2025-05-26



序号	检测对象	项目/参数		检测标准 (方法)	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	恒温恒湿	稳态温湿度偏置寿命试验 JESD22-A101D.01 January, 2021	只测：温度：60℃~85℃，湿度：60%RH~85%RH。 包含租用设备。	2025-05-26
		13	键合强度	半导体器件的机械试验方法 第2部分：方法2001至2999 MIL-STD-750-2B 22 June 2022 2037.1	只测：拉力≤5kg	2025-05-26
		14	剪切强度	键合球剪切强度 AEC - Q101-003 - REV-A July 18, 2005	只测：推力≤100kg	2025-05-26
		15	人体模型静电放电试验	人体模型静电放电试验 AEC-Q101-001 REV-A July 18, 2005	只测：0V~8000V。 租用设备。	2025-05-26
				半导体器件的环境试验方法 第1部分：方法1000至1999 MIL-STD-750-1B 18 April 2023 1020.7	只测：0V~8000V。 租用设备。	2025-05-26
		16	电测	半导体器件 - 第2部分：分立器件-整流二极管 IEC 60747-2 Apr, 2016 6.1.2.3/6.1.3/6.1.4	只测：二极管。 包含租用设备。	2025-05-26
				半导体器件 - 分立器件- 第8部分：场效应晶体管 IEC 60747-8 Dec, 2010+AMD1 Jun, 2021 CSV 6.3.1/6.3.2/6.3.3/6.3.4/6.3.5/6.3.15	只测：晶体管。 包含租用设备。	2025-05-26
				半导体器件 - 第9部分：绝缘栅双极型晶体管 IEC 60747-9 Nov, 2019 6.3.1/6.3.2/6.3.3/6.3.4/6.3.5/ 附录 A	只测：绝缘栅双极型晶体管。 包含租用设备。	2025-05-26

